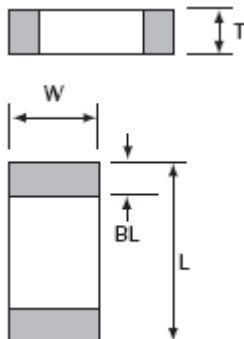
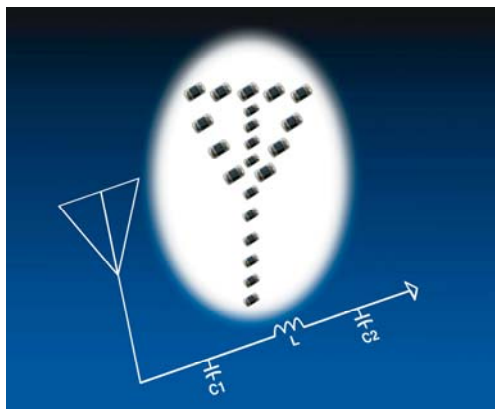




Automotive AntennaGuard



Size (EIA)	0402	0603
L	1.00 ±0.10 (0.040 ±0.004)	1.60±.15 (0.063±0.006)
W	0.50 ±0.10 (0.020 ±0.004)	0.80±0.15 (0.032±0.006)
T	0.60 Max. (0.024 Max.)	0.90 Max (0.035 Max.)
BL	0.25 ±0.15 (0.010 ±0.006)	0.35±0.15 (0.014±0.006)

<u>VC</u>	<u>AS</u>	<u>06</u>	<u>AG</u>	<u>18</u>	<u>3R0</u>	<u>Y</u>	<u>A</u>	<u>I</u>	<u>1</u>	<u>A</u>
Varistor Chip	Series AS=	Case 04=0402 Automotive 06 = 0603	Type	Working Voltage 18=18VDC	Capacitance 3R0=3pF 120=12pF	Non-Std Cap Tol Y=Max	Not Applicable	Termination T=Ni/Sn plated 1= Pd/Ag/Pt	Reel 1=7" 3=13" W=7" (0402 only)	Reel A=4k or 10k

AVX Part Number	Working Voltage (DC)	Working Voltage (AC)	Maximum Leakage Current	Typical Capacitance	Case Size	Elements	Jump Start
VCAS04AG183R0Y	≤ 18	≤ 14	0.1	3	0402	1	27.5
VCAS06AG183R0Y	≤ 18	≤ 14	0.1	3	0603	1	27.5
VCAS06AG18120Y	≤ 18	≤ 14	0.1	12	0603	1	27.5

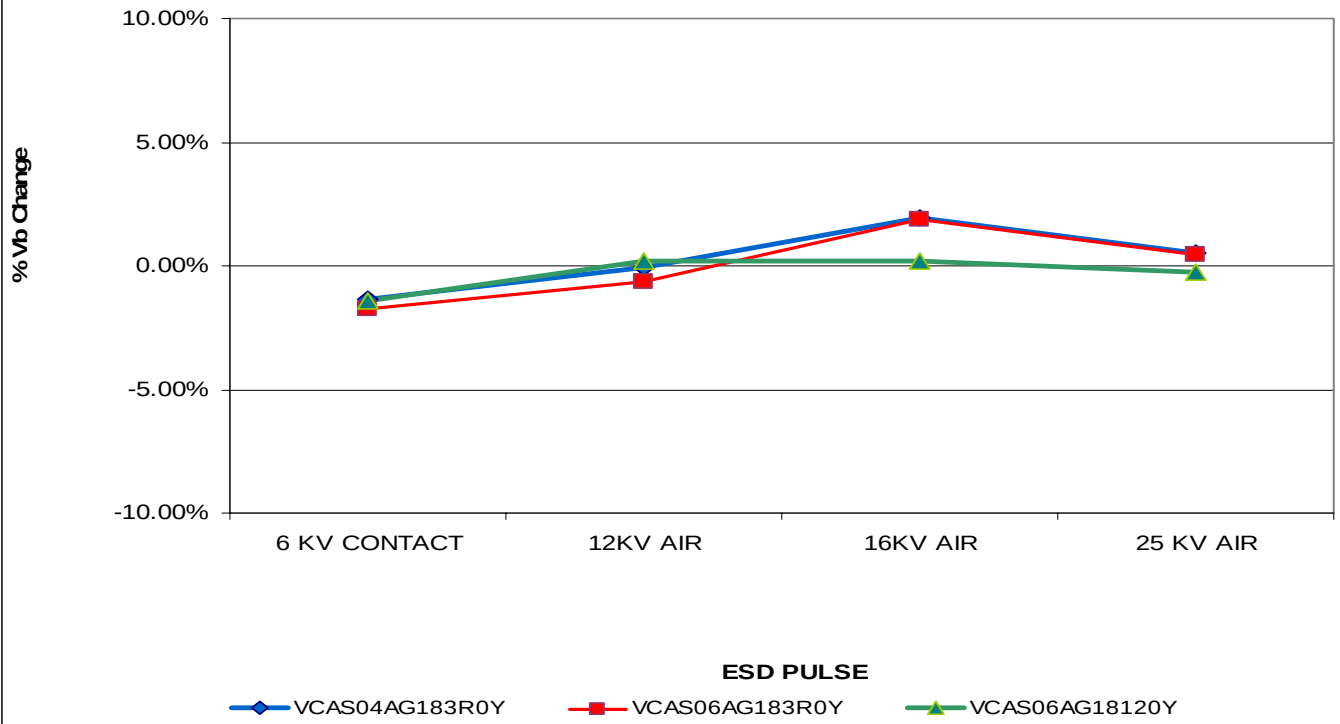
V_w(DC) DC Working Voltage [V]

V_w(AC) AC Working Voltage [V]

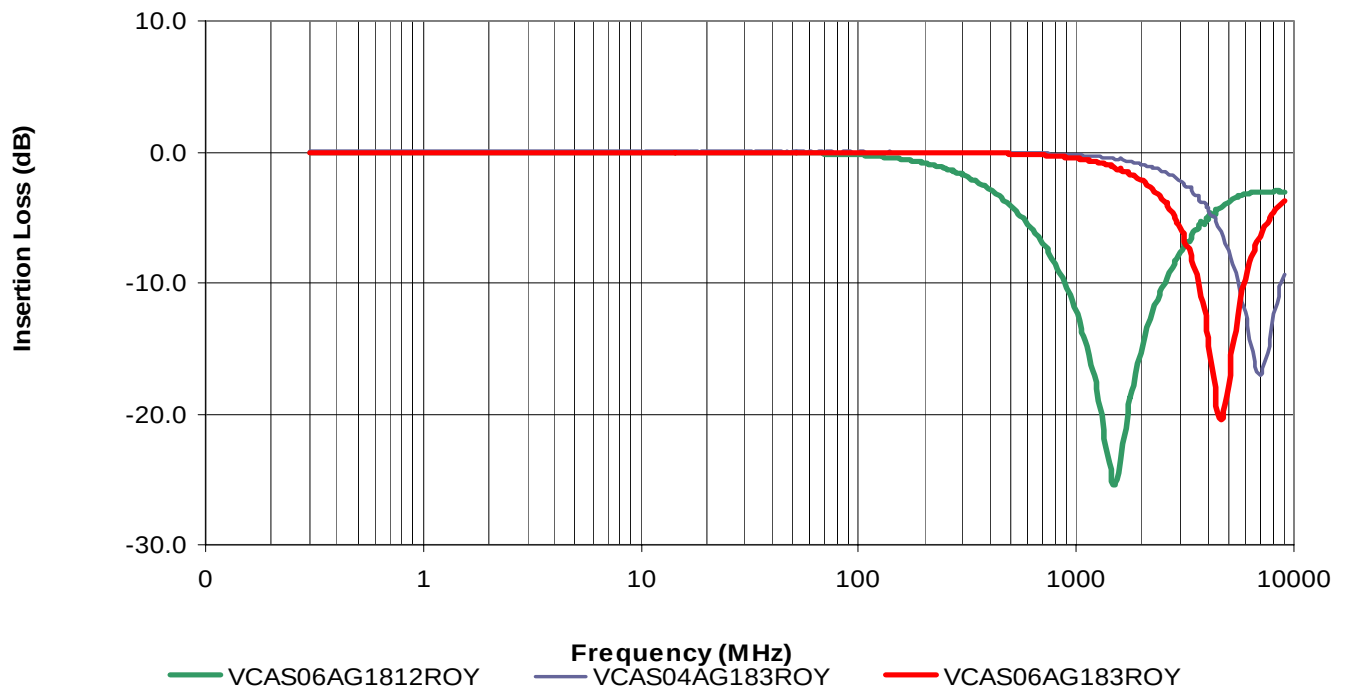
I_L Maximum leakage current at the working voltage [μA]

Cap Typical capacitance [pF] @ frequency specified and 0.5V_{RMS}

**AEC-Q200 Pulse Test
AEC-Q200-002**



S21 Response



No.	Item	Requirement	Test Method
1	Operating Temp.	-55°C to +125° C	
2	Appearance/Dimensions	No visible damage Dimensions: see par 6	Visual examination at 10% magnification Dimensions verification by class2 caliper
3	Solderability	The dipped surface shall be at least 95% covered with a new smooth solder coating.	Soak in eutectic solder bath of temperature at 230+/-5°C for 5sec.
4	Solder heat resistance	No mechanical damage. Capacitance: 3 pF Leakage: <100nA	a. Read capacitance and leakage. b. Soak in eutectic solder bath of temperature at 260+/-5°C. for 10+/-1sec. c. Natural cool down to +25°C d. Read capacitance and leakage after 24+/-2 hours.
5	Humidity Life	Capacitance: 3 pF Leakage: <100nA	a. Read capacitance and leakage. b. Leave device in chamber of +85+/-3°C, 85+/-5% relative humidity for 1,000± 5hours. c. Read capacitance and leakage after 3-4 hours conditioning at 25+/-5°C
6	Life Test	Capacitance: 3 pF Leakage: <100nA	a. Read capacitance and leakage. b. Apply 100% of working voltage at test temperature of 125+/-4°C for 1,000+48/-0hours. c. Read capacitance and leakage after 24+/-2 hours conditioning at 25+/- 5°C

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9